

Model : EC-80P

非破壊式（渦電流法）シート抵抗/抵抗率測定器



ペンタイププローブを簡易接触させるだけで測定
サンプルにダメージを与えず、任意の場所の測定が可能

機能・特長

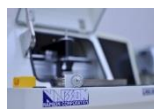
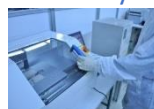
- 取り扱いの容易なハンディプローブを採用
- 測定モードの切替で、シート抵抗と抵抗率での表示が可能
- JOGダイヤルによる容易な測定条件設定
- 抵抗測定プローブは、レンジ別にラインナップしており、幅広いレンジに対応
(抵抗プローブ：最大2本+PN判定プローブを同時接続可能)
※プローブ2~3本目は、オプション対応となります。
- 測定スポット径（プローブコア径）：
14mmφ

測定対象

- ウエハサンプル；
シリコンベア、化合物(GaN,GaP)、エピ、
拡散層、SiCなど
 - 各種薄膜サンプル；
半導体プロセス膜、メタル膜、ITO膜など
 - その他
- *原則として、測定レンジ内であれば、どんなサンプルでも測定可能です。

対象サイズ

*サイズ、厚さによらず測定が可能



測定レンジ

* プローブ同時接続：最大2タイプまで、所持数：最大3タイプまでとなります。

プローブタイプ	測定レンジ
(1) Low	0.01 - 0.5 ohm/sq (0.001 - 0.05 ohm.cm)
(2) Middle	0.5 - 10 ohm/sq (0.05 - 0.5 ohm.cm)
(3) High	10 - 1000 ohm/sq (0.5 - 60 ohm.cm)
(4) Super High	1000 - 3000 ohm/sq (60 - 180 ohm.cm)
(5) Solar wafer	5 - 500 ohm/sq (0.2 - 15 ohm.cm)

* 抵抗率[ohm.cm]は、ウエハ厚さ：(1)~(4)500μmで換算、(5) 200μmで換算

測定再現性

プローブタイプ	%
Low, Middle	≦ 0.5 %
High	≦ 1.0 %
High (small probe : 5mmΦ)	≦ 3.0 %
Super High	≦ 3.0 %
Solar wafer	≦ 3.0 %

*測定再現性：CV = STDEV/P/AVG×100% で計算。
(標準抵抗サンプル：NIST・VLSIを使用し、同一点を10回繰返し測定)

寸法・重量・電源

- <寸法・重量> ・本体：W255 × D275 × H95mm、4kg
・プローブ部：20mmΦ × 80mm
- <電源> AC100V±10%, 50/60Hz, 100VA

- 詳細のお問い合わせは下記までご連絡ください。
- 実機でのサンプル測定が可能です。お気軽にご相談下さい。
- 記載の仕様および外観は、予告なく変更する場合がございます。